

Редько В.В., Бурцева Л.Б., Редько Л.А. Приборы электроискрового контроля изоляции кабельных изделий	9
Нестерук Д.А., Хорев В.С., Коробов К.Н. Инфракрасно-ультразвуковой контроль воды в сотовых панелях самолета	11
Беспалько А.А., Яворович Л.В., Бомбизов А.А., Лоцилов А.Г. Регистратор электромагнитных сигналов для контроля изменений напряженного состояния горных пород	14
Суржиков В.П., Хорсов Н.Н., Хорсов П.Н. Мультисенсорная система для исследования дефектности диэлектрических материалов	17
Фурса Т.В., Суржиков А.П., Данн Д.Д., Осипов К.Ю. Разработка метода определения дефектности бетона на основе явления механоэлектрических преобразований	21
Авдеева Д.К., Лажина И.А., Пеньков П.Г., Рыбалка С.А., Уваров А.А. Экспериментальные исследования высокочувствительного канала на нанoeлектродах для измерения биопотенциалов человека	24
Шаркеев Ю.П., Белявская О.А., Ерошенко А.Ю., Капранов Б.И., Белкин Д.С., Клименов В.А. Исследование имплантатов из наноструктурированного титана методом рентгеновской микротомографии	28
Вавилов В.П. История, современное состояние и тенденция развития теплового контроля	32
Сырямкин В.И., Жданов Д.С., Глушков Г.С., Бородин В.А. Интеллектуальные интегрированные структурно-перестраиваемые системы контроля и мониторинга широкого применения	37
Бориков В.Н., Баранов П.Ф., Цимбалист Э.И., Ким В.Л. Устройство для испытаний и поверки индуктивных делителей напряжения	41
Клименов В.А., Бузник В.М., Борозна В.Ю., Твердохлебов С.И. Диагностика композиции металл-полимер, сформированной на поверхности титанового сплава при ультразвуковой обработке	45
Якубов В.П., Шипилов С.Э., Клоков А.В., Федянин И.С. Радиотомография по неполным данным	51
Романенко С.В., Заика Я.Г. Оценка систематической погрешности инверсионно-вольтамперометрического определения концентрации иодид-ионов при контроле элемента в объектах окружающей среды	54
Панин В.Е., Панин С.В., Бяков А.В., Бурков М.В., Любутин П.С. Многомасштабный метод анализа деформации металлических сплавов и углерод-углеродных композиционных материалов по данным тензометрии, картирования деформации на поверхности и акустоэмиссии	56
Толбанов О.П., Толбанова Р.И. Детекторы гамма излучений на основе GaAs<Cr> для исследования наноструктур	63
Голубятников И.В. 75 лет Московскому Государственному Университету приборостроения и информатики	71